

Table 7.3. Contribution of Japanese papers in ferrous analysis. (1990–1991)

Area	Main subjects	Number of papers		Contribution*
		Total	Japanese	
General considerations	Review	26	8	Med.
Atomic absorption	F-AAS, ET-AAS	31	5	Low
Optical emission	Spark	14	6	Hi.
	ICP	28	9	Med.
	GDS, etc.	28	9	Med.
X-ray fluorescence	Bulk, TR-XRF	32	9	Low
Mass spectrometry	ICP-MS, GD-MS	18	8	Hi.
Thermal extraction	C, S, O, N, H	12	5	Hi.
Chemical methods	MAS, Titrimetry, FIA, etc.	13	2	Low
Inclusions, phases	Electrolysis, etc.	15	3	Low
Surface techniques	SIMS, SNMS, etc.	24	8	Med.
Molten metal analysis	Spectroscopic	14	11	Hi.
	Gas extraction	6	3	Hi.
	Electrochemical	24	16	Hi.
Miscellaneous	HP-LC, CRM, etc.	33	6	Low
Total		318	108 (34%)	

* Share of Japanese papers; over 40%: Hi., 30–40%: Med., below 30%: Low.

の研究だけでなく、表面分析法、ナノ領域構造解析法および有機分析法の研究や、これらの材料研究への適用など、総合的キャラクタリゼーションを行える体制を持つことも特徴である。

鉄鋼分析における研究開発活動は、日本では各社の研究部門や製鉄所を中心に、大学や国立研究所でも行われ、その上本会の共同研究会や日本学術振興会などの共同研究もあり活発であるが、欧州では各社単独でのそれは減り、EC委員会からの援助による研究や共同研究が多く、米国では研究発表がほとんどなくなり、旧ソ連はこれまで研究発表が多かったが最近は激減し、アジアを中心が移った感がある。

分析値は材料の研究開発や原料の検査、製造における品質管理、品質保証、環境管理に寄与しているが、その信頼性を維持、向上させることは分析技術開発と同様に重要なことで

ある。1980年代から物や技術の国際交流の増大に伴って分析値の重要性が再認識され、その信頼性を第三者にもわかる形で保証する体制を国際的に確立する動きが起こり、1990年代から欧米で実施され始めた。すなわち、ISOなど分析方法の国際標準化活動の活性化、分析の品質システムを審査する分析所の認定(Laboratory accreditation)，標準物質の認証(Certified reference material)，分析所が出す分析値の水準をチェックする共同実験(Proficiency testing)などの体制を国際的基準に合わせて作り、実行し始めた。日本では分析における品質管理を実際に良く実行してきたが、それは分析値の製造者の立場であり第三者に見える形のものではなく、これらの欧米の動きには対応が遅れている。一刻も早く国全体としての体制の確立をはかり実行すべきであると考えている。

7.2 材料開発に寄与した技術の成果

分析、評価分野において、この約10年間に材料開発に寄与した技術成果は材料開発分野で要求が生ずる以前に開発された技術と、要求に応じて開発された技術、あるいは、材料開発のための研究に必要な技術と材料生産に必要な技術などに分けられる。この10年間におけるマイクロコンピューターを始めとする情報機器の発達、そして真空技術、ロボッ

ト技術などの発達が同時に進行していたことも考え併せる必要がある。材料生産に必要な技術として生産現場からの要望も加味すると我が国においては蛍光X線法に加えて発光分光分析におけるパルス分布測定法を始めとする各種分析法が出現、発展し、オンライン分析や製鋼分析室の無人化を可能とした。これらに関しては7.3に詳しく触れられる。

その中の表面処理鋼板におけるグロー放電発光分光法の導入と前後しての AES, XPS, SIMS, FT-IR などの各種表面分析法が材料開発研究に果たした役割は無視できない。それらは元素の結合状態、原子レベルにいたる局所分析などが材料開発の分野で注目され、開発システムの中に取り入れられ始めたに他ならない。

7.2 の各項目でも述べられるが、7.2.3 では VAMAS プロジェクトにおける表面分析にさきがけて、部会表面分析小委員会ではスパッタリングの精度、AES における定量分析の精度、同じく XPS による定量分析の精度、XPS における化学シフトの測定精度、深さ方向分析におけるスパッタリング収率の測定、AES 定量分析における装置因子の補正、AES による状態分析法、酸化物試料の XPS による定量分析、XPS による化学シフトの測定、シリコンウェハーの表面汚染元素の SIMS による定量分析、グロー放電発光分光法による表面定量分析に関する研究活動が行われた。

しかも 7.2.4 で紹介されるように鉄鋼製品の高級化、多様化に伴い、微細析出相や微細構造を解析するため AP-FIM や STM など各種高分解能電子顕微鏡技術と、それに伴って発展してきた試料調製法などが原子、分子レベルの測定を可能にした。

また 7.2.2 で述べられるように、通常の実験室で直ちに測定ということは困難であるが SOR 光の利用による材料解析は金属の凝固過程や結晶成長過程の X 線トポグラフなど従来得られなかった情報を与えている。

一方、7.2.1 で紹介されるが高清淨鋼の研究開発に伴い、超微量元素の分析が要望され、ICP-OES, ICP-MS, GD-MS などによる分析法の開発も行われた。特に鉄鋼中非金属元素の低減は急であり、それらの分析法も分析試料の表面汚染が問題となり（数 ppm レベル）、標準試料委員会や部会の研究小委員会を始め各社の取組みにより、かなり改善され、C, S, N, O, H など各種非金属元素も比較的高感度の分析が実施されるようになった。ただ鉄鋼材料を初め金属材料の分析では、matrix 元素が分析元素の 10^6 倍以上存在する可能性が大きいことを常に念頭に置かなければならない。すなわち matrix をある程度分離しなければ、高分解能分離法として報告されている 10^3 程度の matrix しか考慮していない分離法を、直ちに応用することはほとんど不可能である。しかも

鉄を初めとする金属分析法の研究は非破壊、非分離そして個人誤差のない高い再現性のある方法が要求されてきたことは周知の事実である。

これら鉄鋼材料を含めた我が国における金属材料の分析法の研究は、7.3 のプロセス管理に寄与した分析技術を含めて各国に多く引用されている。しかも我が国の鉄鋼分析が長年 ISO-TC 17 (鉄鋼分析), TC-102 (鉄鉱石分析) などにおける活動状況と、そこで果たして来た役割の大きさも見逃してはならない。

特に材料の品質の保証ひいては製品の品質管理において、成分元素、微量元素の分析を含めて標準ならびに標準化試料、標準物質の作製、整備、確保が材料開発を支えるために最終的に重要な事項である。物質や材料の最終的な基準を確保しておくことは国策上重要であり各国とも標準物質の作製、整備、確保が十分に行われた時代は材料生産技術が高揚している。しかも先進国と言われている国では、かつて、その国で作製、確保した標準試料、標準物質を背景に品質管理の基準化を求めてきている。

7.2.1 高清淨度鋼開発における極微量分析技術の開発

高清淨度鋼の製鍊とその開発、そして鉄鋼材料の高機能化は同時に ppm レベル以下の微量元素の分析法の要求と、その分析技術の開発につながって来た。超微量分析技術の開発は(1)環境の整備すなわち、現在は半導体、超高度非鉄金属の分析では常識とされるクリーンルーム（もちろん恒温恒湿）などの確保、(2)各元素 10 ppt レベル以下の高純度試薬と高清淨器具の確保、(3)超高感度測定法の開発と選択、そしてその的確な操作が課題となる。この場合超高感度分析を遂行するために現在のところ、超微量成分の濃縮分離が要求される場合が多い。もちろん 10^6 倍以上のマトリックスからの分離のために新たに提案された分離法や定量法も多い。しかも、分離操作に伴う汚染の侵入を防ぐために、Fig. 7.2 にその操作と使用器具の例を示すが、試料採取量を少なく、かつ数少ない操作ができるだけクローズドの状態で実施する分析法も研究されている。これら分離法ならびに定量法は環境による汚染が少ないとることはもちろんあるが、逆に環境汚染への問題を出さず、かつ経済性を考慮した定量方法としては ICP-OES と GF-AAS から ICP-MS (同位体希釈法、高温炉

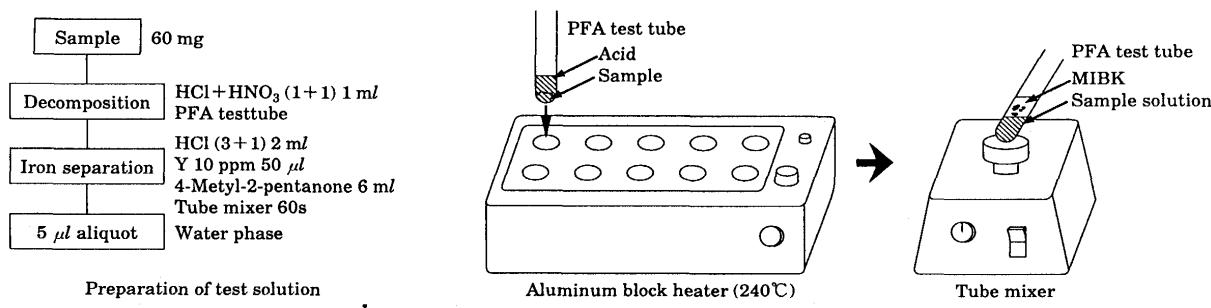


Fig. 7.2. Procedure for sample dissolution and solvent extraction to avoid the contamination. (*Tetsu-to-Hagané*, 77 (1991), p. 1952)